

〈設備名称〉 テラヘルツ分光装置

〈管理担当者〉 秋田大学大学院 工学資源学研究科  
情報工学専攻 教授 水戸部一孝

〈設備構成〉

名称	型番
1. テラヘルツ分光測定装置	TSS- II GW
2. 界面測定装置	
3. 試料冷却装置	
4. 高感度測定装置	



〈測定原理・その他の詳細〉

- ・テラヘルツ光源 : 単一周波数掃引型, 差周波発生方式 発振周波数 0.3THz~45THz(GaP, GaSe)
- ・線幅 : 4GHz以下(@2THz近傍)
- ・テラヘルツ検出器 : 手動切り替え  
0.5THz~7.0THz 室温測定用, 周波数較正用:DTGS (1 set 3台)  
12THz~50 THz 高周波領域測定用:MCT (1 set 2台)
- ・試料温度範囲 : 室温

※注意事項: 水による吸収が大きいため, 水分を含有した試料は測定できません.

〈使用料(税抜)〉 780円/時

〈設置場所〉

秋田大学  
ベンチャーインキュベーションセンター 204研究室

〈使用例〉

試料分子の結合状態の測定等. THz帯の電磁波による可視化技術開発を実施するために使用.